This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 23. Mai 2002 (23.05.2002)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/41410 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

H01L 33/00

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE01/04264

[DE/DE]; Augustenstrasse 13, 93049 Regensburg (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:

14. November 2001 (14.11.2001)

(74) Anwalt: EPPING HERMANN & FISCHER; Ridlerstrasse 55, 80339 München (DE).

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WIRTH, Ralph

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, JP, KR, US.

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 14. November 2000 (14.11.2000) 100 56 292.2

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH & CO. OHG [DE/DE]; Wernerwerkstr. 2, 93049 Regensburg (DE).

Veröffentlicht:

(72) Erfinder; und

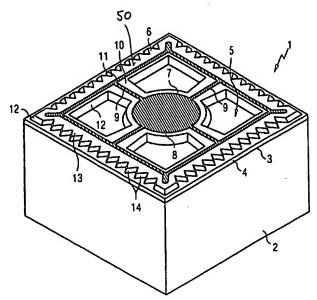
mit internationalem Recherchenbericht

vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: LUMINESCENT DIODE WITH HIGH DECOUPLING EFFICIENCY

(54) Bezeichnung: LUMINESZENZDIODE MIT HOHER AUSKOPPELEFFIZIENZ



(57) Abstract: A luminescent diode (1) comprises a window layer (4) with sawtooth shaped decoupling steps arranged above an active layer (3). Boundary lines (11) run above the decoupling steps (6) by means of which the current is injected into the active Name (3). The luminescent diode (1) is characterised in having a high decoupling efficiency.

(57) Zusammenfassung: Eine Lumineszenzdiode (1) weist oberhalb einer aktiven Schicht (3) eine Fensterschicht (4) mit sägezahnförmig profilierten Auskoppelstegen (6) auf. Oberhalb der Auskoppelstege (6) verlaufen Randleitungen (11), durch die der Strom in die aktive Schicht (3) injiziert wird. Die Lumineszenzdiode (1) zeichnet sich durch eine besonders hohe Auskoppeleffizienz aus.



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Beschreibung

LUMINESZENZDIODE MIT HOHER AUSKOPPELEFFIZIENZ

Die Erfindung betrifft eine Lumineszenzdiode mit einer Photonen emittierenden aktiven Schicht und einer zumindest für einen Teil der emittierten Photonen durchlässigen Fensterschicht, auf der mindestens ein Kontakt zur Stromeinspeisung in die aktive Schicht ausgebildet ist.

10

15

20

Eine derartige Lumineszenzdiode ist aus der US 52 33 204 A bekannt. Die bekannte Lumineszenzdiode weist einen Licht erzeugenden Bereich auf, der auf einem absorbierenden Substrat angeordnet ist. Oberhalb des Licht erzeugenden Bereichs ist eine Fensterschicht angeordnet, deren Dicke so gewählt ist, daß an einer Oberseite der Fensterschicht totalreflektierte Lichtstrahlen nicht zum Substrat gelenkt werden, sondern auf eine Seitenfläche der Fensterschicht treffen und dort aus der Fensterschicht austreten können. Die Fensterschicht hat darüber hinaus die Aufgabe, den über eine Kontaktstelle in die Fensterschicht eingespeisten Strom gleichmäßig über den aktiven Bereich hinweg zu verteilen.

Ein Nachteil der bekannten Lumineszenzdiode ist, daß unmittelbar unter der Kontaktstelle im aktiven Bereich erzeugtes
Licht nicht ohne weiteres entweichen kann. Insbesondere die
in Richtung auf die Kontaktstelle von dem aktiven Bereich
ausgehenden Lichtstrahlen werden von der Kontaktstelle größtenteils in das absorbierende Substrat zurückreflektiert.

30

Es wurde daher in der EP 0 544 512 A vorgeschlagen, auf die Fensterschicht zu verzichten und statt dessen baumartige strukturierte Leiterbahnen auf der Oberfläche der Leuchtdiode vorzusehen. Die Besonderheit dabei ist, daß die Leiterbahnen bis auf die Spitzen der Leiterbahnzweige von der darunterliegenden Schicht elektrisch isoliert sind. Der Strom wird daher nur punktförmig in die darunterliegenden, Licht erzeugenden

2

Schichten eingespeist. Diese Stellen sind jedoch gleichmäßig über die Oberfläche der Lumineszenzdiode hinweg verteilt. Zur Steigerung der Lichtausbeute wird ferner vorgeschlagen, in der Nähe der Licht emittierenden Punkte abgeschrägte Lichtaustrittsflächen vorzusehen, so daß das erzeugte Licht nach einer kurzen Wegstrecke in der Lumineszenzdiode aus dieser austreten kann. Die abgeschrägten Lichtaustrittsflächen werden durch eine mesaförmige Ausgestaltung der unter der Leiterbahn liegenden Schichten bewerkstelligt. Bei diesen Schichten handelt es sich um die zur Ausbildung einer doppelten Heterostruktur erforderlichen, dotierten Abdeckschichten, zwischen denen eine undotierte Licht emittierende Schicht angeordnet ist. Durch eine derartige Anordnung konnte die Lichtausbeute im Vergleich zum damaligen Stand der Technik um einen Faktor 1,5 gesteigert werden.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Lumineszenzdiode mit weiter verbesserter Lichtausbeute zu schaffen.

20

10

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Lumineszenzdiode mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 gelöst.

Ein wesentliches Merkmal der Erfindung besteht darin, daß der Kontakt von einer Leiterbahn gebildet wird, die auf einer vorzugsweise entlang der Leiterbahn langgestreckten Erhebung der Fensterschicht angeordnet ist, von der eine Seitenfläche mit sich quer zur Leiterbahn erstreckenden Vorsprüngen profiliert ist.

30

35

25

Durch die Ausbildung des Kontakts als Leiterbahn wird der Strom in die aktive Schicht nicht nur punktförmig, sondern über eine größere langestreckte Fläche in die aktive Schicht injiziert. Ein wesentlicher Teil der in der aktiven Schicht erzeugten Photonen können die Lumineszenzdiode über die Seitenfläche der Erhebung der Fensterschicht verlassen. Dies gilt auch für einen Großteil von solchen Photonen, deren Bah-

3

nen in der Fensterschicht nahezu längs der Leiterbahn und damit längs der Erstreckungsrichtung der Erhebung verlaufen und bei einer nicht profilierten Fensterschicht an deren äußeren Grenzfläche totalreflektiert werden würden. Denn durch die Profilierung der Seitenfläche mit sich quer zur Leiterbahn erstreckenden Vorsprüngen, treffen auch diese Photonen auf einen Abschnitt der Seitenfläche unter einem Winkel, der kleiner als der Winkel für die Totalreflexion ist. Daher gehen diese Photonen nicht verloren, sondern tragen zur Steigerung der Lichtausbeute bei. In einem Experiment ergab sich eine Erhöhung der Lichtausbeute gegenüber den aus dem Stand der Technik bekannten Lumineszenzdioden mit einfacher Fensterschicht etwa um den Faktor 2.

- 15 Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung sind die Vorsprünge pyramidenstumpfartig ausgebildet, bei denen die von deren Seitenflächen eingschlossenen Winkel derart gewählt sind, dass in ihnen verlaufende Photonentrajektorien nach jedem Auftreffen auf die Flanken eines Vorsprunges in einem einen spitzeren Winkel auf die nachfolgend erreichte Flanke auftreffen, und zwar so oft bis der Grenzwinkel der Totalreflexion unterschritten wird und das Photon aus der Fensterschicht austritt.
- Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

Nachfolgend wird die Erfindung im einzelnen anhand der beigefügten Zeichnung erläutert. Es zeigen:

30

Figur 1 eine schematische Darstellung einer perspektivischen Ansicht einer Lumineszenzdiode, die Leiterbahnzüge auf einer Fensterschicht mit sägezahnförmig profilierten Seitenflächen aufweist; WO 02/41410

eine schematische Darstellung einer vergrößerten Figur 2 Darstellung der Profilierung der Seitenflächen der Lumineszenzdiode aus Figur 1; eine schematische Darstellung einer Aufsicht auf Figur 3 die Lumineszenzdiode aus Figur 1; eine schematische Darstellung eines Querschnitts Figur 4 durch die Lumineszenzdiode aus Figur 3 entlang der Schnittlinie IV-IV; ein Diagramm, das die Lichterzeugung in der aktiven Figur 5 Schicht entlang der Schnittlinie IV-IV schematisch zeigt; eine schematische Darstellung eines Querschnitts Figur 6 durch eine herkömmliche Lumineszenzdiode mit einer auf einem Substrat aufgebrachten aktiven Schicht, auf der eine zusätzliche Fensterschicht angeordnet ist; Figur 7 ein Diagramm, das die Lichterzeugung in der aktiven Schicht über den Querschnitt aus Figur 6 hinweg schematisch zeigt; eine schematische Darstellung eines Querschnitts Figur 8 durch eine Lumineszenzdiode, deren aktive Schicht strukturiert ist und die eine zentrale Kontaktstelle aufweist;

PCT/DE01/04264

30

25

10

15

20

- Figur 9 ein Diagramm, das die Lichterzeugung in der aktiven Schicht der Lumineszenzdiode aus Figur 8 schematisch darstellt;
- 35 Figur 10 eine schematische Darstellung eines Querschnitts durch eine Lumineszenzdiode mit unstrukturierter Fensterschicht, deren Leiterbahnen entsprechend den

5

Leiterbahnen der Leuchtdiode aus Figur 1 ausgebildet sind;

Figur 11 ein Diagramm, das die Lichterzeugung in der aktiven Schicht der Lumineszenzdiode aus Figur 10 schematisch zeigt; und

5

10

15

20

25

30

35

Figur 12 eine schematische Darstellung einer Aufsicht auf eine abgewandelte Form der Lumineszenzdiode gemäß der Erfindung.

Die Lumineszenzdiode 1 der Figuren 1 und 3 weist ein Substrat 2 auf, auf dem eine photonenemittierende aktive Schicht 3 aufgebracht ist. Eine solche aktive Schicht 3 kann aus einer einzigen Schicht bestehen oder eine Schichtenfolge mit einer Mehrzahl von Einzelschichten sein.

Oberhalb der aktiven Schicht 3 befindet sich eine Fensterschicht 4, die auf einer Oberseite 5 eine Erhöhung in Form eines umlaufenden Randsteges 6, der hier einen Auskoppelsteg darstellt, aufweist. In der Mitte der Oberseite 5 befindet sich auf einer zentralen Erhöhung 7 eine Kontaktstelle 8, die gegenüber der Fensterschicht 4 elektrisch isoliert ist. Über Verbindungsleitungen 9, die zwischen der zentralen Erhöhung 7 und dem Randsteg 6 wiederum auf von Erhöhungen der Fensterschicht 4 gebildeten Verbindungsstegen 10 verläufen, ist die Kontaktstelle 8 mit einer Randleitung 11, die sich auf dem Randsteg 6 befindet verbunden. Auch die Verbindungsleitungen 9 sind gegenüber der Fensterschicht 4 elektrisch isoliert. Der Strom gelangt daher zumindest im Wesentlichen nur über die Randleitung 11 in die aktive Schicht 3.

Der Randsteg 6 weist eine die Oberseite 5 der Fensterschicht 4 mit der Oberseite 50 des Randsteges 6 verbindende Seitenfläche 12 auf, die sägezahnartig mit sich quer zur Erstrekkungsrichtung der Randleitung 11 erstreckenden Vorsprüngen 13 profiliert sind. Die Vorsprünge 13 sind pyramidenstumpfartig

6

ausgebildet und weisen zumindest teilweise schräg zur Oberseite 5 stehende Flanken 14 auf.

In Figur 2 ist einer der Vorsprünge 13 vergrößert dargestellt. Die Neigung der Flanken 14 ist so gewählt, daß der Winkel φ zwischen einer Normalen 15 einer Flanke 14 und einer Normalen 16 der aktiven Schicht 3 kleiner 88° und größer 45° ist. Die Winkel α (= der von einer ersten Flanke des Vorsprungs 13 mit der Erstreckungsrichtung der Randleitung 11 eingeschlossene Winkel), β (= der von einer zweiten Flanke des Vorsprungs 13 mit der Erstreckungsrichtung der Randleitung 11 eingeschlossene Winkel), γ (= der von der ersten-Flanke und der zweiten Flanke des Vorsprungs 13 eingeschlossene Winkel) sind vorzugsweise so gewählt, daß einer dieser Winkel kleiner 10° ist. Außerdem sollte keiner der Winkel gleich 45° oder gleich 60° sein, da in diesen hochsymmmetrischen Fällen die Auskoppeleffizienz sinkt. Ferner ist es von Vorteil, wenn für das Verhältnis V.der Breite b von Engstellen 17 des Randsteges 16 zu der Höhe des Randsteges 6 gilt: 0,1 < V < 10, vorzugsweise 1 < V < 3.

10

20

Figur 4 zeigt einen Querschnitt entlang der in Figur 3 eingezeichneten Schnittlinie IV-IV. Figur 5 zeigt die Lichterzeugungsrate entlang der Schnittlinie IV-IV. Unter Lichterzeugung ist dabei die Rate der in der aktiven Schicht 3 erzeugten Photonen zu verstehen, welche im wesentlichen die Stromdichte und damit die besonderen Eigenschaften der jeweiligen Strominjektion wiederspiegelt.

Man erkennt, daß die Lichterzeugungsrate unmittelbar unter der Kontaktstelle 8 verschwindend gering ist. Dementsprechend weist die Lichterzeugungsrate dort ein Minimum 18 auf. Im Bereich des Randsteges 6 weist die Lichterzeugungsrate jedoch Maxima 19 auf, da dort der Strom von der Randleitung 11, die im Gegensatz zu der Kontaktstelle 8 und den Verbindungsleitungen 9 nicht gegenüber der Fensterschicht elektrisch isoliert ist, in die Fensterschicht 4 injiziert wird. Für eine

7

effiziente Lichtauskopplung ist von Bedeutung, daß sich der profilierte Randsteg 6 in unmittelbarer Nähe der Maxima 19 der Lichterzeugungsrate befinden. Denn die Kombination von lokaler Strominjektion und Strukturierung auf der Oberseite der Fensterschicht 4 führt zu einer hohen Lichtausbeute. Dies sei im folgenden anhand der in den Figuren 6 bis 11 dargestellten Vergleichsbeispiele näher erläutert.

Bei folgenden Untersuchungen wurde eine Grundfläche der Lumineszenzdioden von 300 Mikrometer x 300 Mikrometer und ein absorbierendes Substrat verwendet. Die Dicke der aktiven Schicht war 200 nm und ein Absorptionskoeffizient lag bei 10.000/cm. Die Dicke der Fensterschicht war 10 Mikrometer, die Reflektivität der Kontakte lag bei 30%, der Brechungsindex der aktiven Schicht war bei 3,2, im übrigen innerhalb des Halbleiterchips bei 3,5. Der Brechungsindex des umgebenden Mediums war bei 1,5.

Vergleichsbeispiel 1:

20

10

15

Betrachtet sei die in Figur 6 dargestellte würfelförmige Lumineszenzdiode 20. Diese Lumineszenzdiode 20 weist ein Substrat 21 auf, auf dem eine aktive Schicht 22 ausgebildet ist, die von einer Fensterschicht 23 abgedeckt ist. Auf der Fensterschicht 23 befindet sich ferner eine zentrale Kontaktstelle 24, die gegenüber der Fensterschicht 23 nicht elektrisch isoliert ist. Bei einer solchen Lumineszenzdiode ergibt sich die in Figur 7 dargestellte Verteilungskurve 25 der Lichterzeugungsrate.

30

35

25

Ein Vergleich der Figuren 6 und 7 zeigt, daß die maximale Lichterzeugung unmittelbar unter der zentralen Kontaktstelle 24 stattfindet. Ein Großteil der dort erzeugten Photonen wird jedoch entweder unmittelbar an der Grenzfläche zur Kontaktstelle 24 absorbiert oder von der Kontaktstelle 24 in das absorbierende Substrat 21 zurückreflektiert. Dementsprechend werden bei dieser Lumineszenzdiode 20 nur etwa 5% der erzeug-

8

ten Photonen aus der Lumineszenzdiode 20 ausgekoppelt. Das Verhältnis von austretenden Photonen zu der Zahl der erzeugten Photonen wird nachfolgend kurz als Auskoppeleffizienz bezeichnet. Im folgenden wird zum relativen Vergleich die Effizienz der Lumineszenzdiode 20 auf 100% gesetzt.

Vergleichsbeispiel 2:

In Figur 8 ist der Querschnitt einer weiteren Lumineszenzdiode 26 dargestellt, deren Fensterschicht 27 entsprechend
der Fensterschicht 4 der Lumineszenzdiode 1 strukturiert ist.
Auch bei der Lumineszenzdiode 26 erfolgt die Strominjektion
in die aktive Schicht 22 über die zentrale Kontaktstelle 24.

Dadurch ergibt sich die in Figur 9 dargestellte unter der Kontaktstelle 24 konzentrierte Verteilung 28 der Lichterzeugungsrate.

Die Lichterzeugung findet auch bei dieser Lumineszenzdiode 26

20 hauptsächlich unmittelbar unter der Kontaktstelle 24 statt.

Auf die Auskoppeleffizienz der Lumineszenzdiode 20 bezogen,

weist die Lumineszenzdiode 26 eine um 50% erhöhte Auskoppel
effizienz, das heißt 150% auf. Dies ist für sich genommen be
reits bemerkenswert, da auch bei der Verteilungskurve 25 die

25 Lichterzeugung keinesfalls unmittelbar unter dem Randsteg 29

konzentriert ist, der dem Randsteg 6 der Lumineszenzdiode 1

entspricht. Diese Untersuchung belegt daher bereits die vor
teilhafte Wirkung eines am Rand der Lumineszenzdiode 1 vorgesehenen, sägezahnförmig profilierten Randsteges 6.

Vergleichsbeispiel 3:

30

Hierbei wurde, wie in Figur 10 dargstellt, eine Lumineszenzdiode 30 verwendet, bei der eine Fensterschicht 23, wie bei
35 der Lumineszenzdiode 20, unstrukturiert ist. Die Lumineszenzdiode 30 verfügt jedoch über eine Randleitung 31 und Verbindungsleitungen 32 sowie über eine zentrale Kontaktstelle 33,

9

die genauso wie die Randleitungen 11, die Verbindungsleitungen 9 und die Kontaktstelle 8 der Lumineszenzdiode 1 ausgebildet sind. Insbesondere sind die Kontaktstelle 33 und die Verbindungsleitungen 32 von der Fensterschicht 23 elektrisch isoliert.

Damit ergibt sich die in Figur 11 dargestellte Verteilungskurve 34 der Lichterzeugungsrate, die unter der Randleitung
33 ein Maximum 35 aufweist. Aufgrund der Stromaufweitungs10 funktion der Fensterschicht 23 fließt dennoch ein Teil des in
die aktive Schicht 22 injizierten Stroms in den Bereich unterhalb der zentralen Kontaktstelle 33. Daher findet auch im
Minimum 36 der Verteilungskurve 34 noch Lichterzeugung statt.
Auf die Auskoppeleffizienz der Lumineszenzdiode 20 bezogen,
15 weist die Lumineszenzdiode 30 eine um 40% erhöhte Auskoppeleffizienz, das heißt 140% auf.

Ausführungsbeispiel:

30

35

Die Untersuchung für das anhand der Figuren 1 bis 4 beschriebene Ausführungsbeispiel ergab folgendes:

Durch den Randsteg 6 wird die Lichterzeugung zusätzlich konzentriert, so daß die Lichterzeugungsrate im Minimum nahezu auf Null zurückgeht. Außerdem befindet sich der profilierte

Randsteg 6 unmittelbar in der Nähe der Maxima 19 der Lichterzeugungsrate, so daß das erzeugte Licht zu einem großen Teil nach sehr kurzen Weglängen im Chip ausgekoppelt wird.

Für die Lumineszenzdiode 1 ergab die Untersuchung eine auf die Auskoppeleffizienz der Lumineszenzdiode 20 bezogene Erhöhung der Auskoppeleffizienz von 175%, als eine Auskoppeleffizienz von 275%. Es zeigt sich also, daß die gezielte Injektion des Stromes unter dem profilierten Randsteg 6 ein Gewinn an Auskoppeleffizienz zur Folge hat, der weit über denjenigen Gewinn hinausgeht, der aus der Kombination der Einzelmaßnahmen zu erwarten wäre.

10

Zu dem hohen Gewinn an Auskoppeleffizienz trägt auch die pyramidenstumpfartige Ausgestaltung der Vorsprünge 13 bei. Durch die genannte Wahl der Winkel α , β und γ wird der Einfallswinkel der Photonen mit jeder Reflexion an einer Flanke kleiner und unterschreitet schließlich den Grenzwinkel für die Totalreflexion, so daß die Photonen aus der Lumineszenzdiode 1 austreten können. Darüber hinaus gewährleistet der Neigungswinkel der Flanken 14, daß die zunächst von der aktiven Schicht 3 nach oben verlaufenden Photonen mit jeder Reflexion flacher verlaufen, so daß sie schließlich seitlich aus den Randstegen 6 austreten können.

Es sei angemerkt, daß es sich bei den Vorsprüngen 13 auch um Prismen mit dreieckiger Grundfläche handeln kann, wenn sich die Randstege bis in die aktive Zone erstrecken.

10

15

20

In Figur 12 ist schließlich ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Lumineszenzdiode 37 dargestellt, die zusätzlich zum Randsteg 6 weitere Auskoppelstege in Form von Zwischenstegen 38 aufweist, die jeweils mit Vorsprüngen 13 profiliert sind, und auf denen Zwischenleitungen 39 verlaufen. Außerdem befindet sich bei dieser Lumineszenzdiode 37 eine Kontaktstelle 40 nicht mittig auf, sondern am Rand der Lumineszenzdiode 37.

Abschließend sei als besonderer Vorteil der Lumineszenzdioden 1 und 30 hervorgehoben, daß deren flächenmäßige Ausdehnung nahezu beliebig groß gewählt werden kann, da eine Vergrößerung der flächenmäßigen Ausdehnung keine entsprechende Skalierung der Schichtdicke der Fensterschicht 4 erzwingt. Dieser Vorteil der Erfindung hält die Herstellung von großflächigen Chips mit Fensterschicht hinsichtlich des technischen Aufwandes in einem vertretbaren Rahmen.

Die erfindungsgemäßen Strukturen einer Lumineszenzdiode, insbesondere die oben beschriebenen Ausführungsbeispiele, eignen sich vorzugsweise für Lumineszenzdiodenstrukturen mit einer strahlungsemittierenden Schicht auf der Basis von GaP, wie

11

InGaP, InGaAlP, GaAlP und GaP selbst, insbesondere mit einer strahlungsemittierenden Schicht, die eine aktive Zone auf der Basis von GaP, wie InGaP, InGaAlP, GaAlP und GaP aufweist. Derartige Lumineszenzstrukturen sind bekannt und werden von daher an dieser Stelle nicht näher erläutert.

12

Patentansprüche

Lumineszenzdiode mit einer Photonen emittierenden aktiven Schicht (3) und einer zumindest für einen Teil der emittierten Photonen transparenten Fensterschicht (4), auf der ein elektrischer Kontakt zur Stromeinspeisung in die aktive Schicht (3) ausgebildet ist,

dadurch gekennzeichnet, daß die Fensterschicht einen langgestreckten Auskoppelsteg (6)

aufweist, auf dem eine langgestreckte Kontaktleitung (11,19) ausgebildet ist und der Auskoppelsteg mindestens eine längs zur Kontaktleitung (11,19) verlaufende Seitenfläche (12) aufweist, die mit sich quer zur Kontaktleitung (11,19) erstrekkenden Vorsprüngen (13) profiliert ist.

15

- 2. Lumineszenzdiode nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Vorsprünge (13) spitz zulaufen.
- 20 3. Lumineszenzdiode nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Vorsprünge (13) eine dreieckige Grundfläche aufweisen.
- Lumineszenzdiode nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
 die Vorsprünge (13) ein sägezahnartiges Profil an der Seitenfläche (12) ausbilden.
- Lumineszenzdiode nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
 ein Scheitelwinkel y der spitz zulaufenden Vorsprünge (13)
 in der Spitze kleiner 10° ist.
- 6. Lumineszenzdiode nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
 35 dadurch gekennzeichnet, daß
 der Winkel zwischen einer Flächennormalen (15) zumindest
 teilweise die Seitenfläche bildenden Flanken (14) der Vor-

13

- sprünge (13) zu einer Flächennormalen (16) der aktiven Schicht (3) zwischen 45° und 88° liegt.
- 7. Lumineszenzdiode nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
 6 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
 6 sich die Seitenfläche (12) in die aktive Schicht (3) hinein
 fortsetzen.
 - 8. Lumineszenzdiode nach Anspruch 7,
- 10 dadurch gekennzeichnet, daß die Vorsprünge (13) prismenartig ausgebildet sind.
- 9. Lumineszenzdiode nach einem der Ansprüche 1 bis 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß 15 das Verhältnis von Höhe zu Breite einer Engstelle (17) des profilierten Auskoppelstegs (6) der Fensterschicht größer 0,1 und kleiner 10 ist.
 - 10. Lumineszenzdiode nach Anspruch 9,

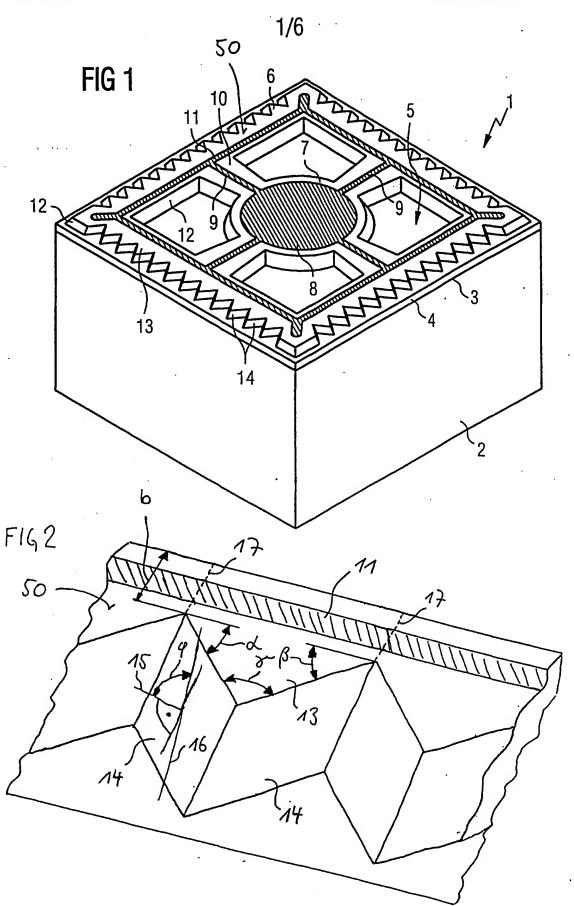
35

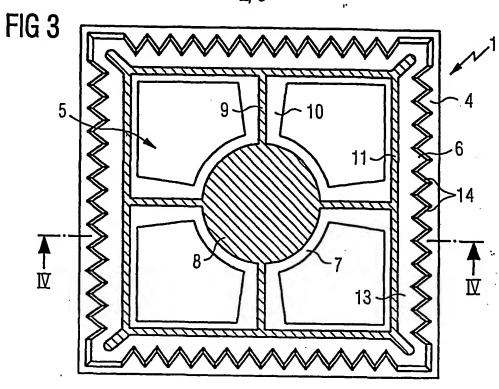
- 20 dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis zwischen einschließlich 1 und einschließlich 3 liegt.
 - 11. Lumineszenzdiode nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
- 25 dadurch gekennzeichnet, daß die Kontaktleitung (11,39) als entlang dem Rand der Lumineszenzdiode umlaufende Leiterbahn ausgebildet ist.
- Lumineszenzdiode nach einem der vorhergehenden Ansprü che,
 - d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Kontaktleitung (11,39) durch mindestens eine gegenüber der Fensterschicht (4) elektrisch isolierte Verbindungsleitung (9) mit einer Kontakstelle (8) verbunden ist.
 - 13. Lumineszenzdiode nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dad urch gekennzeichnet, daß

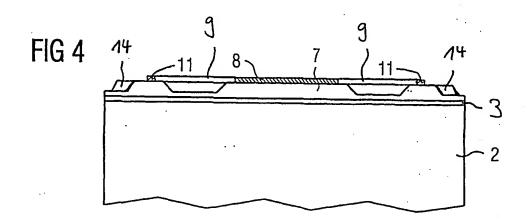
14

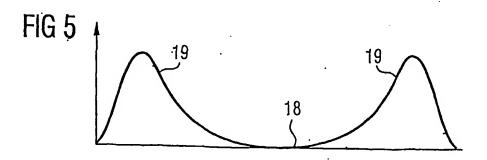
die eine bzw. die Kontaktstelle (8) gegenüber der Fensterschicht (4) elektrisch isoliert ist.

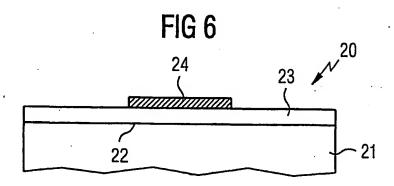
14. Lumineszenzdiode nach einem der vorangehenden Ansprüche, 5 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der Auskoppelsteg (6) von einer Erhöhung der Fensterschicht (4) gebildet ist.

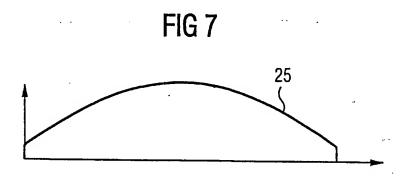


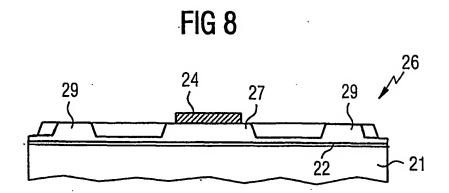


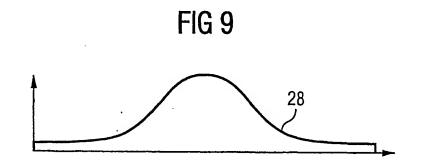


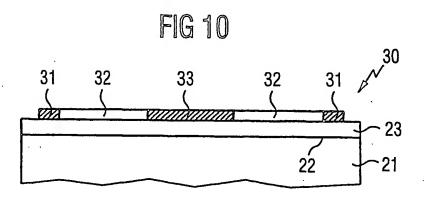












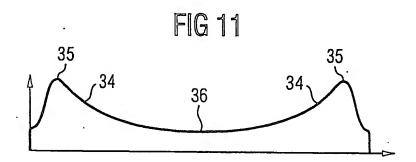
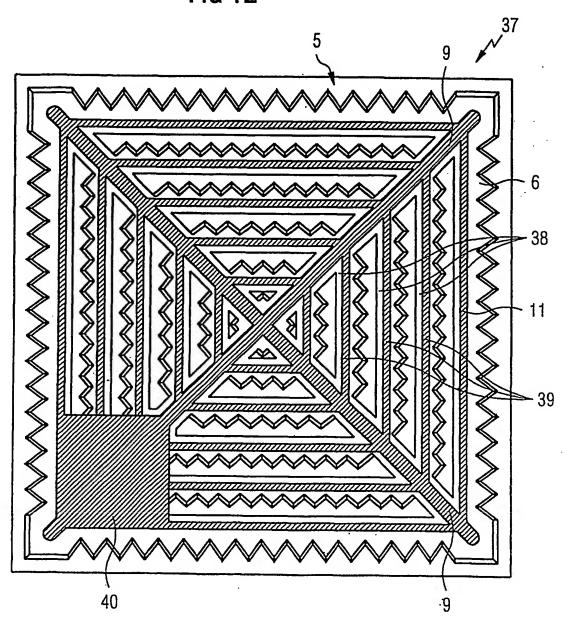


FIG 12



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte one Application No PCT/DE 01/04264

		PCT/DE 01/	04264
A CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L33/00		
_According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	tion and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum do IPC 7	currentation searched (dassification system tollowed by dassification H01L	n symbols)	
Documental	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in the fields as	arched
	ata base consulted during the international search (name of data bas ternal, PAJ	e and, where practical, search terms used)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category.*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rela	evant passages	Relevant to claim No.
Υ	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 336 (E-1237), 21 July 1992 (1992-07-21) -& JP 04 100277 A (TOSHIBA CORP),		1-4,7, 11-14
	2 April 1992 (1992-04-02) abstract; figures 1,16		
Υ .	DE 42 18 806 A (TELEFUNKEN MICROE 9 December 1993 (1993-12-09) the whole document	LECTRON)	1-4,7, 11-14
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1996, no. 08, 30 August 1996 (1996-08-30) -& JP 08 111544 A (SHARP CORP), 30 April 1996 (1996-04-30) paragraphs '0014!,'0033!; figure	es 5,18	1-4,11
		-/	
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	In arnex.
Special care 'A' docume consider 'E' earlier of filing of the charles 'C' docume other 'P' docume later to	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is clied to establish the publication date of another in or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	"I" later document published after the int or priority date and not in conflict will ched to understand the principle or it invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot myoke an inventive step when the d document of particular relevance; the cannot be considered to involve an it document is combined with one or n ments, such combination being obvi in the art. "&" document member of the same paten	n the application but nearly underlying the claimed invention of the considered to ocument is taken alone claimed invention nearlive step when the rore other such docur-ous to a person sidilled at tamily
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international so 03/04/2002	earch report
	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patenthaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijsvijk Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 91 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016	van der Linden,	J.E.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte One Application No
PCT/DE 01/04264

25 September 1997 (1997-09-25) the whole document A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 141 (E-406), 24 May 1986 (1986-05-24) & JP 61 005585 A (ROHM KK), 11 January 1986 (1986-01-11) abstract A US 5 744 828 A (NISHITANI K ET AL) 28 April 1998 (1998-04-28) the whole document A DE 195 17 697 A (TELEFUNKEN MICROELECTRON) 14 November 1996 (1996-11-14) the whole document A US 5 753 940 A (KOMOTO S) 19 May 1998 (1998-05-19) the whole document			PCITUE UI	7 0 1 2 0 1
DE 197 09 228 A (HEWLETT PACKARD CO) 25 September 1997 (1997-09-25) the whole document A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 141 (E-406), 24 May 1986 (1986-05-24) & JP 61 005585 A (ROHM KK), 11 January 1986 (1986-01-11) abstract A US 5 744 828 A (NISHITANI K ET AL) 28 April 1998 (1998-04-28) the whole document A DE 195 17 697 A (TELEFUNKEN MICROELECTRON) 1,12,13 14 November 1996 (1996-11-14) the whole document A US 5 753 940 A (KOMOTO S) 19 May 1998 (1998-05-19) the whole document P,X WO 01 61765 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS) 1,2,11, 23 August 2001 (2001-08-23)				Relevant to claim No.
25 September 1997 (1997-09-25) the whole document A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 141 (E-406), 24 May 1986 (1986-05-24) & JP 61 005585 A (ROHM KK), 11 January 1986 (1986-01-11) abstract A US 5 744 828 A (NISHITANI K ET AL) 28 April 1998 (1998-04-28) the whole document A DE 195 17 697 A (TELEFUNKEN MICROELECTRON) 14 November 1996 (1996-11-14) the whole document A US 5 753 940 A (KOMOTO S) 19 May 1998 (1998-05-19) the whole document P,X WO 01 61765 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS) 1,2,11, 23 August 2001 (2001-08-23)	Category	Charlet of document with indication, where appropriates of the relation passages		100741100
vol. 010, no. 141 (E-406), 24 May 1986 (1986-05-24) & JP 61 005585 A (ROHM KK), 11 January 1986 (1986-01-11) abstract A US 5 744 828 A (NISHITANI K ET AL) 28 April 1998 (1998-04-28) the whole document A DE 195 17 697 A (TELEFUNKEN MICROELECTRON) 14 November 1996 (1996-11-14) the whole document A US 5 753 940 A (KOMOTO S) 19 May 1998 (1998-05-19) the whole document P,X WO 01 61765 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS) 23 August 2001 (2001-08-23)	A	25 September 1997 (1997-09-25)		1-4
28 April 1998 (1998-04-28) the whole document DE 195 17 697 A (TELEFUNKEN MICROELECTRON) 14 November 1996 (1996-11-14) the whole document A US 5 753 940 A (KOMOTO S) 19 May 1998 (1998-05-19) the whole document P,X WO 01 61765 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS) 23 August 2001 (2001-08-23) 1,2,11,	Α	vol. 010, no. 141 (E-406), 24 May 1986 (1986-05-24) & JP 61 005585 A (ROHM KK), 11 January 1986 (1986-01-11)		1,11-14
14 November 1996 (1996-11-14) the whole document A US 5 753 940 A (KOMOTO S) 19 May 1998 (1998-05-19) the whole document P,X WO 01 61765 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS) 23 August 2001 (2001-08-23) 1,2,11,	A	28 April 1998 (1998-04-28)		1,11-13
19 May 1998 (1998-05-19) the whole document P,X WO 01 61765 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS) 23 August 2001 (2001-08-23) 1,2,11, 14	A	14 November 1996 (1996-11-14)		1,12,13
23 August 2001 (2001-08-23) 14	A	19 May 1998 (1998-05-19)		1,7
	P,X .	23 August 2001 (2001-08-23)		A
			,	
				,
	ta e e		•	
		·		
		·		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT information on patent family members

Inte onal Application No
PCT/DE 01/04264

						CI/DE	01/04204
	ent document In search report		Publication date		Patent family member(s)	•	Publication date
JP	04100277	Α	02-04-1992	NONE			
DE	4218806	A	09-12-1993	DE	4218806	A1	09-12-1993
JP	08111544	Α	30-04-1996	JP	3027095	B2	27-03-2000
DE	19709228	A	25-09-1997	US	5779924		14-07-1998
				DE	19709228		25-09-1997
				GB	2311413	A ,B	24-09-1997
				JP	10004209	Α	06-01-1998
				SG	54385	A1	16-11-1998
JP	61005585	A	11-01-1986	JP	1820413	С	27-01-1994
				JP	5031317	В	12-05-1993
US	5744828	A	28-04-1998	JP	9036431	Α	07-02-1997
DE	19517697	A	14-11-1996	DE	19517697	A1	14-11-1996
				JP	8316525	Α	29-11-1996
				US ·	5698865	Α	16-12-1997
US	5753940	A	19-05-1998	JP	3241976	B2	25-12-2001
				JP	9116189	A	02-05-1997
MO	0161765	A	23-08-2001	DE	10006738	A1	13-09-2001
				AU	2504501	Α	27-08-2001
				AU	3918201	A	27-08-2001
				WO	0161764	A1	23-08-2001
				WO	0161765		23-08-2001
				WO	0191194		29-11-2001
			•	DE	10107472		06-12-2001
				DE	20111659		13-12-2001

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte onates Aktenzeichen
PCT/DE 01/04264

			101/02 01/042	71
A. KLASSIF IPK 7	TZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L33/00			
			•	
	emationalen Patertiklassifikation (IPK) oder nach dar nationalen Klassif	ikation und der IPK		
	RCHIERTE GEBIETE Ler Mindestprütstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)	<u>-</u> .	
IPK 7	H01L	•		
Recherchler	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowe	ell diese unter die rec	herchierten Gebiete fallen	
Während de	r Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Nar	ne der Datenbank ur	d avtl. verwendete Suchbe	griffe)
EPO-Int	ternal, PAJ			
	<u> </u>			
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht komm	enden Telle	Betr. Anspruch Nr.
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 336 (E-1237), 21. Juli 1992 (1992-07-21) -& JP 04 100277 A (TOSHIBA CORP), 2. April 1992 (1992-04-02) Zusammenfassung; Abbildungen 1,16			1-4,7, 11-14
Y	DE 42 18 806 A (TELEFUNKEN MICROEL 9. Dezember 1993 (1993-12-09) das ganze Dokument	_ECTRON)		1-4,7, 11-14
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1996, no. 08, 30. August 1996 (1996-08-30) -& JP 08 111544 A (SHARP CORP), 30. April 1996 (1996-04-30) Absätze '0014!,'0033!; Abbildunge	en 5,18		1-4,11
	·	/		
	ltere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Slehe Anhan	ng Patentfamille	
Besonder 'A' Veröffe aber i 'E' ålteres Anme 'L' Veröffe schet ander soll o ausge 'O' Veröff ethe i 'P' Veröffe	re Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist s Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen slidedatum veröffentlicht worden ist entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- men zu lessen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbercht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie efführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnehmen bezieht	oder dem Prioritä Anmeldung nicht Erfindung zugrun Theorie angegeb "X" Veröffentlichung v kann albein aufgn erfinderischer Tä "Y" Veröffentlichung v kann nicht als au werden, wenn di Veröffentlichung diese Verbindun	on besonderer Bedeutung; und dieser Veröffentlichung linkelt bennhend betrachtet	en ist und mil der Verständnis des der der ihr zugrundeliegenden die beanspruchte Erfindung nicht als neu oder auf werden die beanspruchte Erfindung ruhend betrachtel oder mehreren anderen indung gebracht wird und liegend ist
Datum des	Abschlusses der Internationalen Recherche		les internationalen Recherc	henberichts
4	22. Mārz 2002	03/04/	² 2002	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rüswijk Tal. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,	Bevolimächtigte		
i	Fax: (+31-70) 340-2040, 1x: 31 651 epo m,	į van de	er Linden, J.E.	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte oncics Aktonzeichen
PCT/DE 01/04264

(Forteet)	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		1/04264
egorte*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweil erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden T	elle	Betr. Anspruch Nr.
\	DE 197 09 228 A (HEWLETT PACKARD CO) 25. September 1997 (1997-09-25) das ganze Dokument		1-4
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 141 (E-406), 24. Mai 1986 (1986-05-24) & JP 61 005585 A (ROHM KK), 11. Januar 1986 (1986-01-11) Zusammenfassung		1,11-14
A	US 5 744 828 A (NISHITANI K ET AL) 28. April 1998 (1998-04-28) das ganze Dokument		1,11-13
A	DE 195 17 697 A (TELEFUNKEN MICROELECTRON) 14. November 1996 (1996-11-14) das ganze Dokument		1,12,13
A	US 5 753 940 A (KOMOTO S) 19. Mai 1998 (1998-05-19) das ganze Dokument		1,7
Ρ,Χ	WO 01 61765 A (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS) 23. August 2001 (2001-08-23) Seite 13 -Seite 15, Zeile 30		1,2,11,
			·

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentiamtile gehören

Inte nales Aktenzeichen PCT/DE 01/04264

im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 04100277	A 02-04-1992	KEINE	•
DE 4218806	A 09-12-1993	DE 4218806 A1	09-12-1993
JP 08111544	A 30-04-1996	JP 3027095 B2	27-03-2000
DE 19709228	A 25-09-1997	US 5779924 A DE 19709228 A1	14-07-1998 25-09-1997
-		GB 2311413 A ,B JP 10004209 A SG 54385 A1	24-09-1997 06-01-1998 16-11-1998
JP 61005585	A 11-01-1986	JP 1820413 C JP 5031317 B	27-01-1994 12-05-1993
US 5744828	A 28-04-1998	JP 9036431 A	07-02-1997
DE 19517697	A 14-11-1996	DE 19517697 A1 JP 8316525 A US 5698865 A	14-11-1996 29-11-1996 16-12-1997
US 5753940	A 19-05-1998	JP 3241976 B2 JP 9116189 A	25-12-2001 02-05-1997
₩O 0161765	A 23-08-2001	DE 10006738 A1 AU 2504501 A AU 3918201 A WO 0161764 A1 WO 0161765 A1 WO 0191194 A1 DE 10107472 A1 DE 20111659 U1	13-09-2001 27-08-2001 27-08-2001 23-08-2001 23-08-2001 29-11-2001 06-12-2001 13-12-2001